



中华人民共和国国家标准

GB/T 20725—2006/ISO 17470:2004

波谱法定性点分析电子探针 显微分析导则

Electron probe microanalysis guidelines for qualitative point analysis by
wavelength dispersive X-ray spectrometry

(ISO 17470:2004, Microbeam analysis—Electron probe
microanalysis—Guidelines for qualitative point analysis
by wavelength dispersive X-ray spectrometry, IDT)

2006-12-25 发布

2007-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准等同采用 ISO 17470:2004《波谱法定性点分析电子探针显微分析导则》(英文版)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国科学院上海硅酸盐研究所。

本标准主要起草人:曾毅、李香庭。

引 言

电子探针显微分析常常用于定性鉴别试样中微区范围内存在的元素,为了避免错误的分析结果,必须规范测量条件和元素鉴别方法。